

33. **Téma: *Příprava a měření tenkých povrchových vrstev iontovým svazkem***

- **Typ práce:** BP s možností pokračování
- **Zadávající:** Prof. Ing. J. Král, CSc., KFE
- **Abstrakt:** Experimentální práce, užívající metod PIXE, RBS pro měření tenkých vrstev vakuově napařovaných či vytvořených iontovou implantací.
- **Student:**